

CRITICAL RATE of RISE of ON-STATE CURRENT TESTER / 臨界オン電流上昇率試験器 MODEL: DIDT1250Z

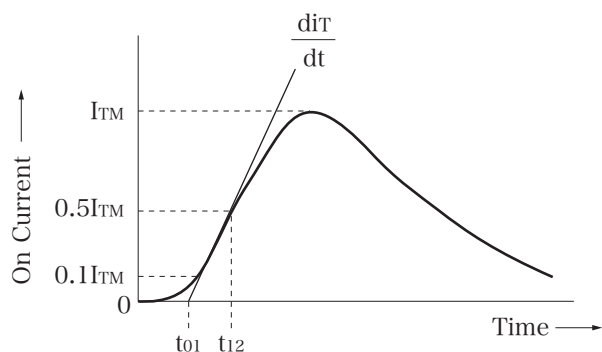
DIDT1250Z is the tester for checking whether triac and thyristor can withstand critical on-state current by forcing waveform conforming to the critical rate of rise of on-state current test method (EIAJ ED4521-(4.2.8)).

diT/dt can be changed by setting variable coil and VD voltage.

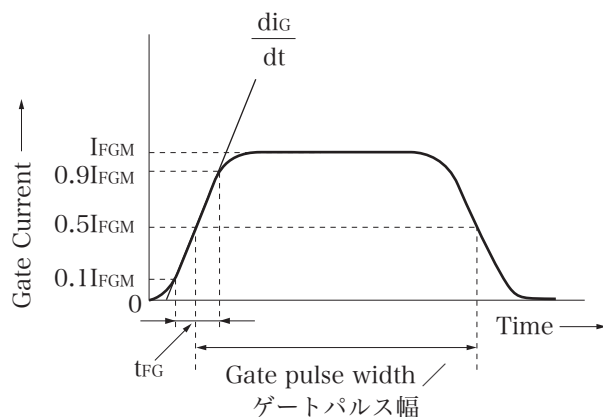
本器は、EIAJ ED4521-(4.2.8)の臨界オン電流上昇率試験方式に準じた波形を印加し、供試トライアック及びサイリスタが臨界オン電流率に耐えうるかどうかを確認する試験器です。diT/dtは可変コイルとVD電圧の設定により変更する事ができます。



1) On Current Waveform / オン電流波形



2) Gate Current Waveform / ゲート電流波形



半導体デバイス試験装置メーカー
株式会社 キヤッツ電子設計

CONTACT

TEL : CATS Inc. SENDAI OFFICE TEL.022-371-8777

E-mail : cats-sendai@world.ocn.ne.jp

* Reproduction or appropriation of writings, images and photographs from within this catalogue is prohibited.

* 本カタログ内の記述、画像、写真の無断転載・転用を禁止します。